

共通機器一覧 List of I2CNER shared equipment(As of 2018.4.1)

Location	Person in charge	Equipment	Manufacturer/Type	Category	購入年度		
1 I-201	松田助教/貞清助教	Dr. Matsuda / Dr. Sadakiyo	全自動X線回折システム	Automatic X-ray Diffraction System	株式会社SmartLab 9kW AMK	Advanced	23年度
2 I-201	渡邊准教授/高垣准教授	Prof. Watanabe	高速ラマンイメージング分光分析システム	Raman Imaging Spectrometer System	RENISHAW/inVia Raman Microscope	General	23年度
3 I-201	高垣准教授	Prof. Takagaki	酸素・窒素・水素分析装置	O2, H2, N2 ANALYZER	株式会社EMGA-930-SKU	General	23年度
4 I-201	ユン准教授	Prof. Yoon	円二色分散計/Chirascan CD	Chirascan CD Spectrometer	アプライドフォトフィジクス/Chirascan CD	Advanced	28年度
5 I-201	藤川准教授/久保田教/高垣准教授	Prof. Fujikawa Prof. Kubota Prof. Takagaki	電界放出形走査電子顕微鏡SEM	Scanning Electron Microscope_SEM	日本電子株式会社/JSM-7900F	Advanced	29年度
6 I-201	高垣准教授	Prof. Takagaki	冷却断面加工装置	Cross section machining apparatus	日本電子株式会社/IB-19520CCP	Advanced	29年度
1 I-403	西原准教授	Prof. Nishihara	膜抵抗測定システム	Film resistance measuring system	株式会社東陽テクニカ/MTS740-C	Advanced	23年度
2 I-403	渡邊准教授	Prof. Watanabe	インピーダンスアナライザ	Impedance analyzer	Solartron Analytical/ModuLab XM ECS	Advanced	29年度
3 I-403	Harish助教	Dr. Harish	キャリア移動度測定装置	Carrier mobility measuring system	分光計器株式会社/CMM-250TP	General	23年度
4 I-403	Harish助教	Dr. Harish	高圧ガス吸着量測定装置	High Pressure Adsorption Measurement	日本ベル株式会社/MSB-GS-100-10M	Advanced	25年度
5 I-403	Harish助教	Dr. Harish	レーザー回折式粒子径分布測定装置	Laser diffraction Particle Size Analyzer	株式会社SALD-2300	General	25年度
6 I-403	Harish助教	Dr. Harish	走査型プローブ顕微鏡	Scanning Probe Microscope	株式会社SPM-9700	General	25年度
7 I-403	主:渡邊准教授 副:山内助教	Prof. Watanabe (Dr. Yamauchi)	高性能比表面積・細孔分布測定装置	Surface Characterization Analyzer	マイクロメリクス/3Flex	General	25年度
8 I-403	田中宏昌助教	Dr. Tanaka	コールドスプレーイオン源搭載TOF-MSシステム	Cold-Spray Ionization TOF MS System	JEOL/JMS-T100LP	Advanced	25年度
9 I-403	谷口准教授	Prof. Taniguchi	光電子顕微鏡システム	Photoemission Electron Microscope System	株式会社My PEEM AV318-A1	Advanced	25年度
10 I-403	谷口准教授	Prof. Taniguchi	示差走査熱量計(DSC)	DIFFERENTIAL SCANNING CALORIMETRY	NETZSCH / DSC204	Advanced	28年度
11 I-403	渡邊准教授	Prof. Watanabe	冷間静水等方圧プレス機	Cold Isostatic Press	エスピーエシステム株式会社/CPA50-300	Advanced	28年度
1 I-404	西原准教授	Prof. Nishihara	マトリクス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型質量分析装置	Mass Spectrometry system	アルカータルニクス/ microflex LT-KCN	General	29年度
2 I-404	西原准教授	Prof. Nishihara	3D測定レーザー顕微鏡	3D Measuring Laser Microscope	OLYMPUS/OLS4000-SAT	General	22年度
3 I-404	カベ助教	Dr. Edalati	高圧ガス吸着量測定装置	High Pressure Isothermal Gas Adsorption Apparatus	日本ベル株式会社/BELSORP-HP-1-MS	Advanced	22年度
4 I-404	西原准教授	Prof. Nishihara	TG-DSC同時測定装置	Simultaneous Thermal Analysis Apparatus	独逸メテックレバノウ社/STA 449F3 Jupiter	Advanced	22年度
5 I-404	渡邊准教授/西原准教授	Prof. Watanabe / Prof. Nishihara	発生ガス分析システム	Quadrupole Mass Spectrometer Coupling	NETZSCH/STA-QMS/GC	General	22年度
6 I-404	高垣准教授	Prof. Takagaki	3元スパッタリング成膜装置	RF Plasma Sputtering Apparatus	株式会社TS-DC-RF303	General	22年度
7 I-404	渡邊准教授	Dr. Watanabe	分光蛍光光度計	SPECTROFLUOROPHOTOMETER	株式会社RF-5300PC	General	23年度
8 I-404	渡邊准教授	Dr. Watanabe	紫外可視近赤外吸収分光光度計	UV-VIS-NIR SPECTROPHOTOMETER	株式会社UUV-3600	General	23年度
9 I-404	渡邊准教授	Dr. Watanabe	赤外顕微鏡	AUTOMATIC INFRARED MACROSCOPE	株式会社AIM-8800	General	23年度
10 I-404	渡邊准教授	Dr. Watanabe	フーリエ変換赤外分光光度計	FOURIER TRANSFORM INFRARED SPECTROPHOTOMETER	株式会社IRPrestige-21	General	23年度
11 I-404	西原准教授	Prof. Nishihara	一軸加圧電気炉	Uniaxial Pressing Electric Ingle	株式会社MHP16-7520	Advanced	23年度
12 I-404	田中宏昌助教	Prof. Sugimura Dr. Tanaka	赤外顕微鏡	Nicolet iN10 MX FT-IR Imaging Microscope	サーモフィッシャーサイエンティフィック/Nicolet iN10 MX	General	23年度
13 I-404	山内教授/増垣助教	Prof. Fujikawa / Dr.Higaki	ArクラスターイオンビームXPS	Ar Cluster Ion Beam XPS	アルバックファイ/PHI5000VersaProbe II	Advanced	25年度
1 II-102	[溶液]谷口准教授/渡邊准教授 [固体]山内教授	Prof. Taniguchi Prof. Watanabe [Solid] Prof. Yamauchi	超伝導核磁気共鳴装置NMR	Nuclear Magnetic Resonance (NMR) Spectroscopy System	BRUKER/AVANCE III 600	Advanced	25年度
2 II-102	田中宏昌助教	Dr. Tanaka	ナノインデンテーションシステム(UHNT)	Ultra Nanoindentation Tester	Anton Paar社/OPX-UNHT	Advanced	28年度
3 II-102	高垣准教授	Prof. Takagaki	桌上型放電プラズマ焼結機	Spark Plasma Sintering (SPS) Systems	富士電波工業株式会社/SPS-211LX	Advanced	28年度
4 II-102	Saha教授 (Harish助教)	Prof. Saha (Dr Harish)	表面エネルギー測定装置	Inverse Gas Chromatography	Surface Measurement Systems社/IGC-SEA	Advanced	28年度
5 II-102	猪石助教	Dr. Inoishi	ホール効果測定装置	Hall Effect Measurement System	ナノメクス社/HL5500PC	Advanced	29年度
6 II-404	渡邊准教授	Prof. Watanabe	共有有機合成室	Common Organic laboratory	オリエンタル他	General	26年度
7 II-404	渡邊准教授	Prof. Watanabe	恒温型熱機械分析装置	ThermoMechanical Analysis	ネッチ・ジャパン(株)/TMA4000SE	Advanced	28年度
8 II-404	高垣准教授	Prof. Takagaki	遊星型ボールミル	Planetary Ball Mill	フリッツユ社/PL-7	Advanced	28年度
9 I-101	高垣准教授	Prof. Takagaki	2次イオン質量分析装置SIMS	Secondary Ion Mass Spectrometry(TOF-SIMS)	ION-TOF社/PS02B11	Advanced	25年度
1 II-サーバルーム(203)	池田助教	Dr. Ikeda	地震探査データ解析システム(計算サーバー)	High-Performance Computing Cluster for Seismic Data Processing	HP	Advanced	25年度
2 II-サーバルーム(203)	池田助教	Dr. Ikeda	基礎研究を目的としたハイパフォーマンスクラスター	High performance cluster for basic research	NEC	Advanced	28年度
3 II-サーバルーム(203)	石原教授(アクベイ特任教授)	Prof. Ishihara (Prof. Akbay)	原子論的シミュレーションを目的としたハイパフォーマンスクラスター	High performance cluster for atomistic simulation	NEC	Advanced	29年度
II-101	高田教授(生田さん)	Prof. Takata (Mr. Ikuta)	液中観察試料ホルダー	In-liquid specimen holder	日本電子株式会社/Poseidon Base PJAS-3031	General	29年度
II-104	ユン准教授(谷田部助教)	Prof. Yoon (Dr. Yatabe)	安定同位体比質量分析システム	Stable Isotope Mass Spectrometer	Isoprime/Isoprime 100	Advanced	25年度
II-203	久保田教授	Prof. Kubota	ハーン型ガバナニ電池式酸素分析計	Trace Oxygen Analyzer MX3/N	日本エアリキード株式会社	Advanced	23年度
HY30	(秋葉特任教授)(松田助教)	Prof. Akiba	炭素材料水素吸蔵特性評価装置	Apparatus for Measurement of Hydrogen Pressure-Composition Isotherms of Carbon Materials	日本重化学工業/J-232-P3-11-21	Advanced	25年度
I-2階ラウンジ	藤川准教授	Prof. Fujikawa	全自動製氷機	automatic icemaker	ホシザキ/IM-25M	General	25年度
I-4階ラウンジ	渡邊准教授	Prof. Watanabe	純水製造装置/2台	pure water system	ホシザキ/IM-25M	General	25年度
I-201.404	渡邊准教授	Prof. Watanabe	純水製造装置/2台	pure water system	ミリポア/Direct-QUV	General	25年度
I-403	Harish助教	Prof. Harish	純水製造装置/1台	pure water system	アドバンテック東洋株式会社/RFU424TA	General	25年度

General: available for everyone.

Advanced: available for only authorized person.